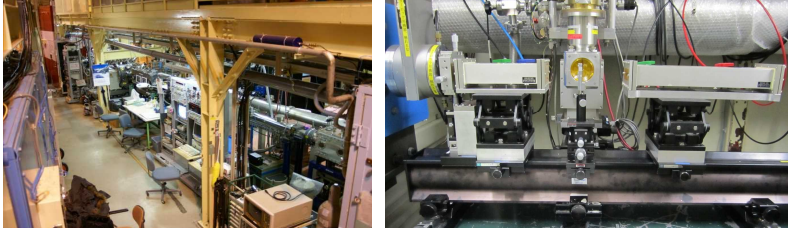



1. 研究者	足立伸一
2. 研究者 DB 等	http://researchmap.jp/read0122581/
3. 所属	物質構造科学研究所 放射光科学第二研究系
4. 研究テーマ	時間分解 X 線測定による物質構造ダイナミクス研究
5. 利用可能な施設・装置等	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">時間分解 X 線ビームライン X 線 CCD 検出器</p>  <p style="text-align: center;">フェムト秒パルスレーザーシステム</p> <p>【主な計測装置】シンチレーションカウンタ、電離箱、フォトダイオード、X 線パルスセクタ、タイミングパルスジェネレータ、ナノ秒 YAG レーザーシステム、ファイバーレーザーシステム、ガラスレーザーシステムほか</p>
6. 研究室等 HP	http://pfwww.kek.jp/adachis/sa/index.html
7. E-MAIL	shinichi.adachi@kek.jp
8. TEL	029-879-6022
9. 特記事項	放射光のもつパルス特性を利用して、ピコ秒以上の時間領域での物質構造変化を直接観測する測定手法を開拓している。また本装置を利用して、光触媒反応機構の解明、光反応性タンパク質の機能解析、高速光応答材料の物性研究などを行っている。

1. 研究者	岸本俊二
2. 研究者 DB 等	http://researchmap.jp/read0051117/ (岸本)
3. 所属	高エネルギー加速器研究機構(KEK) 物質構造科学研究所(IMSS) 放射光科学第一研究系
4. 研究テーマ	超高速および高精細 X 線検出器システムの開発、放射光を用いた原子核励起現象の研究
5. 利用可能な施設・装置等	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>実験ステーション BL-14A : 放射光 X 線による検出器開発を行っている。</p> <p>開発した Si-APD ピクセルアレイ検出器</p> <p>【開発中の検出器システム】 SOI 技術による高精細・高速・高感度二次元 X 線検出器 (科研費・新学術研究)、シリコン・アバランシェフォトダイオード (Si-APD) によるピクセルアレイ X 線検出器システム、マルチアノード・マイクロチャンネルプレート (MCP) 検出器システムなど。</p>
6. 研究室等 HP	担当ビームライン BL-14A : http://pfwww.kek.jp/users_info/station_spec/bl14/bl14a.html 物構研・計測システム開発室 : http://pfwww.kek.jp/KeisokuSystem/index.html
7. E-MAIL	syunji.kishimoto@kek.jp
8. TEL	029-879-6108
9. 特記事項	放射光科学を切り開く新しい検出器システムの開発を行う。既存の放射線検出器も各種そろえており、その理解や応用研究を進めながら研究を進めるため放射線検出器の習熟、様々な放射光応用の現場が体験できる。

1. 研究者	雨宮 健太
2. 研究者 DB 等	http://researchmap.jp/read0067870/
3. 所属	物質構造科学研究所 放射光科学研究施設
4. 研究テーマ	軟 X 線吸収分光(XAFS)を中心とした表面磁性・表面化学の研究
5. 利用可能な施設・装置等	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>軟 X 線可変偏光ビームライン</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>強磁場 XMCD 測定装置</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>磁性薄膜作製装置</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>深さ分解 XAFS 測定装置</p> </div> </div> <p>【主な装置】深さ分解 XAFS 測定装置, X 線磁気円二色性(XMCD)測定装置, 波長分散型 XAFS 測定装置, 電子衝撃加熱蒸着装置, スパッタリング蒸着装置, 表面清浄化装置, 低速陽電子回折装置, 高速反射電子線回折装置, 磁気光学 Kerr 効果測定装置 他</p>
6. 研究室等 HP	http://pfwww.kek.jp/indexj.html
7. E-MAIL	kenta.amemiya@kek.jp
8. TEL	029-864-5656
9. 特記事項	磁性薄膜や清浄表面を真空中で作製し, その場で測定を行う in-situ 観察が特長。原子層レベルの分解能を有する深さ分解 XAFS 法やミリ秒レベルの実時間分解能を波長分散型 XAFS 法など, 新しい測定手法を開発・応用している。

1. 研究者	阿部 仁
2. 研究者 DB 等	http://researchmap.jp/read0206848/ (阿部)
3. 所属	高エネルギー加速器研究機構(KEK) 物質構造科学研究所(IMSS) 放射光科学第二研究系
4. 研究テーマ	主に XAFS を用いた物質化学 (触媒等) , 表面科学, 磁性薄膜
5. 利用可能な施設・装置等	 <p>XAFS 実験ビームライン BL-9A、他。XAFS 測定セットアップ例。</p>  <p>in situ 実験のための自動ガス混合供給昇温システム。</p>
6. 研究室等 HP	http://pfxafs.kek.jp
7. E-MAIL	hitoshi.abe@kek.jp
8. TEL	029-864-5683, 029-864-5200(ex)4972
9. 特記事項	主に XAFS 等の放射光科学に軸足を置いた物質化学 (触媒等) の研究。研究対象は特に限定せず、自主性を重視し、個人の興味に立脚。